

Laboratorio de Metrología en DC y Baja Frecuencia de ETESAL, S.A. de C.V.

Nº de Registro:	LCA-02:11
Responsable:	Ing. José Gilberto Cantón
Correo electrónico:	gcanton@etesal.com.sv
Teléfonos:	2507-6811 / 2507-6805
Sitio web:	No aplica
Dirección:	Final Calle principal, colonia Los Alpes, Soyapango
Ámbito de la acreditación:	Calibración de equipos en magnitudes eléctricas
Vigencia de la acreditación:	Del 28 de marzo del 2024 al 27 de marzo del 2028 Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
Estado de la Acreditación:	Vigente

	Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición o punto de medición			Condiciones de medición		Incertidumbre expandida				Patrón de ref labora	Datos adicionales											
	Magnitud	Instrumento de medición	Método de medida	Procedimiento de calibración	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Valor	Unidades	Factor de cobertura	Nivel de confianza	Descripción del patrón	Origen de trazabilidad	Categoría del laboratorio									
				GUI-01-GEM-	10	500 k	Hz		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0-3.3V	3.1E-05	Hz	2	95%			0									
	Frecuencia	Multímetros/Tenazas Amperimétricas/ Analizadores de Energía	Método	36 Versión: 2 Revisión: 0	45	100 k	Hz	Temperatura, humedad	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 3.3-330V	3.1E-05	Hz	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 5500A/COIL FLUKE 8508A		0									
		Medidores/Generadores de Frecuencia	Directo	PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	45	10 k	Hz	relativa y voltaje	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 330-1000V	1.2E-04	Hz	2	95%			0									
					45	1 k	Hz		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 1-15A	5.8E-02	Hz	2	95%			0									
		Multímetros/Tenazas Amperimétricas/ Analizadores de Energía Medidores de Corriente AC	Método Directo	Método	Método	Método	Método	Método	Método	Método	Método	Método	GUI-01-GEM- 36	29 u	329.99 m	А		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 10 Hz - 30 kHz	1.3E-07	А	2	95%	FLUKE 5520A	0141105	0
2	Corriente AC			Versión: 2 Revisión: 0	0.33	20	А	Temperatura, humedad relativa y	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 45 Hz - 5 kHz	2.2E-04	А	2	95%	FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0									
			Método Indirecto	PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	10	1000	А	frecuencia	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 45 Hz - 300 Hz	5.8E-02	А	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 5500A/COIL	SI/NIST	0									



													2002	Datos		
	Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición o punto de medición			Condiciones	Condiciones de medición		Incertidumbre expandida				Patrón de referencia del laboratorio		
	Magnitud	Instrumento de medición	Método de medida	Procedimiento de calibración	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Valor	Unidades	Factor de cobertura	Nivel de confianza	Descripción del patrón	Origen de trazabilidad	Categoría del laboratorio
			Método Directo		29 u	20	А		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 10 Hz - 30 kHz	7.1E-08	А	2	95%	FLUKE 8508A	SI/NIST	0
		Generadores de Corriente AC	Método Indirecto		1	32	А		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 45 Hz - 420 Hz	7.3E-03	А	2	95%	FLUKE 8508A OMICRON C-SHUNT 1	RON JNT 1 SI/NIST 8508A	0
			mairecto		1	2000	А		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 50 Hz - 60 Hz	2.7E-03	А	2	95%	FLUKE 8508A RITZ KSO1811A		
		Multímetros/Tenazas Amperimétricas/ Analizadores de	Método Directo	and in sec	0	20	А			2.0E-08	А	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0
		Energía Medidores de Corriente DC	Método Indirecto	GUI-01-GEM- 36	10	1000	А			8.9E-02	А	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 5500A/COIL	SI/NIST	0
3	Corriente DC	Generadores de Corriente DC	Método Directo	Versión: 2 Revisión: 0	0	20	А	Temperatura y Humedad	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR	5.8E-08	Α	2	95%	FLUKE 8508A	SI/NIST	0
	DC		Método Indirecto	PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	no s	600	ADO	Relativa	(20 8 33) 78 1110	3.2E-03	E D IT	ACIO	95%	FLUKE 8508A SHUNT E3131 SHUNT E6272 SHUNT 5091 OMICRON C-SHUNT 1	SI/NIST	0
2	Voltaje AC	Multímetros/Tenazas Amperimétricas/ Analizadores de Energía Medidores de Voltaje AC	tricas/ res de ía		2 m	1000	V	Temperatura, humedad relativa y frecuencia	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 45 Hz - 500 kHz	5.3E-06	V	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0
		Generadores de Voltaje AC			2 m	1000	V	Temperatura, humedad relativa y frecuencia	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 45 Hz - 500 kHz	5.8E-04	V	2	95%	FLUKE 8508A	SI/NIST	0
5	Voltaje DC	Multímetros/Tenazas Amperimétricas/ Analizadores de Energía Medidores de Voltaje DC	Método Directo	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2	0	1000	V	Temperatura y Humedad Relativa	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR	2.4E-07	٧	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0
		Generadores de Voltaje DC		Revisión: 0	0	1000	V		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR	5.8E-04	V	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0



				Intervalo de medición o punto				To a said only a second idea				Patrón de ref	Datos			
	Servicio de calibración o medición		de medición		Condiciones de medición		Incertidumbre expandida				laboratorio		adicionales			
	Magnitud	Instrumento de medición	Método de medida	Procedimiento de calibración	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Valor	Unidades	Factor de cobertura	Nivel de confianza	Descripción del patrón	Origen de trazabilidad	Categoría del laboratorio
		Multímetros/Tenazas Amperimétricas Resistencias/Juegos de Resistencias Medidores/Generadores de Resistencia	Método Directo	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	0	1100	МΩ	Temperatura y Humedad Relativa	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR	1.0E-05	Ω	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A FLUKE 8508A	SI/NIST	0
	Resistencia ·	Resistencias (Shunt)	Método Indirecto	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	100 µ	25 m	Ω	Temperatura, humedad relativa y corriente	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 600 A (0 - 1 kHz)	1.0E-07	Ω	2	95%	FLUKE 8508A FLUKE 337 RITZ KSO1811A	SI/NIST	0
6		Medidores de resistencia de Aislamiento	Método Directo	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	10 M	10 G	Ω	Temperatura, humedad relativa y corriente	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 5 kV DC	5.8E+04	Ω	2	95%	Megger CB101	SI/NIST	0
0		Ohmímetros y micro Ohmímetros	Método Directo	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	100 μ	1 m	Ω	Temperatura, humedad relativa y corriente	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 600 A DC	1.0E-07	Ω	2	95%	SHUNT E3131 SHUNT E6272 SHUNT 5091	SI/NIST	0
					1.001	1.009			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 2 A	6.2E-04	Ω	2	95%			
				GUI-01-GEM-	1.010	1.099			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 2 A	6.5E-04	Ω	2	95%			
		Multímetros/Tenazas Amperimétricas Medidores de Resistencia	Método	36 Versión: 2 Revisión: 0	1.100	1.999	Ω	Temperatura y Humedad Relativa	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 2 A	9.1E-04	Ω	2	95%	CROPICO RBB6-B	SI/NIST	0
			Directo	PRM-011 Edición: 2	0	10	Ω	Corriente de prueba	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 200 mA	6.1E-04	Ω	2	95%	CROPICO RBB6-F	SI/INIS I	U
				Revisión: 0	0	100	100		23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 600 mA	7.6E-03	Ω	2	95%			
					0	0 1000			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 20 mA	7.6E-02	Ω	2	95%			



	Servicio de calibración o medición				Intervalo de medición o punto de medición			Condiciones de medición		Incertidumbre expandida				Patrón de ref labora	Datos adicionales	
	Magnitud	Instrumento de medición	Método de medida	Procedimiento de calibración	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Valor	Unidades	Factor de cobertura	Nivel de confianza	Descripción del patrón	Origen de trazabilidad	Categoría del laboratorio
					0	10 k			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 6 mA	7.6E-01	Ω	2	95%			
					0	100 k			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 2 mA	7.6E+00	Ω	2	95%			
					0	1000k			23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR 0 - 0.3 mA	7.6E+01	Ω	2	95%			
7	Capacitancia	Multímetros Tenazas Amperimétricas Capacímetros	Método Directo	GUI-01-GEM- 36 Versión: 2 Revisión: 0 PRM-011 Edición: 2 Revisión: 0	0.19 n	50 m	F	Temperatura y Humedad Relativa	23 ± 1.5 °C (20 a 55) % HR	1.1E-11	F	2	95%	FLUKE 5520A FLUKE 5522A	SI/NIST	0

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
Renovación del ciclo de acreditación	28 de marzo del 2024 al 27 de marzo del 2028

Fin del documento